

★信頼性研究会 (R)

専門委員長 馬渡宏泰 副委員長 弓削哲史

幹事 安里 彰・岡村寛之 幹事補佐 マラット ザニケエフ・田村信幸

日時 11月19日(木) 14:00~16:20

会場 大阪中央電気倶楽部(大阪市北区堂島浜2-1-25. 大阪駅より徒歩12分, JR北新地駅より7分. 地下鉄四つ橋線:西梅田駅より6分. <http://www.chuodenki-club.or.jp/>)

議題 半導体と電子デバイスの信頼性, 信頼性一般

1. 階層ベイズとフィルタリングを用いた信頼性解析 貝瀬 徹(兵庫県立大)
2. ソフトエラーの同時発生範囲の測定方法 ○益田 昇・安永守利(筑波大)
3. 反射率変化観測と変化率イメージングによるパワー MOSFET の動作解析 遠藤幸一(東芝)
4. 市場品質保証のための電子部品の信頼性試験計画 松岡敏成(三菱電機)
5. ライフエンド評価用加速試験一考察 伊藤貞則(イトケン)

◆IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催 日本信頼性学会協賛

☆R研究会今後の予定 []内発表申込締切日

12月18日(金) 機械振興会館〔締切済〕テーマ:信頼性国際規格, 保全性, 信頼性一般

2月19日(金) 伊豆長岡温泉おとり荘〔12月11日(金)〕テーマ:機構デバイスの信頼性, 信頼性一般(共催: 継電器・コンタクトテクノロジー研究会, IEEE CPMT JAPAN, IEEE Reliability Society Japan Chapter, 協賛: 日本信頼性学会)

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

岡村寛之(広島大)

E-mail: okamu@rel.hiroshima-u.ac.jp